

## BA-CAM Strahlanalysekamera, Einzelpunkt-Strahlprofilmessgerät



Produkt **#86-902** NEU KONTAKT

- 1 + €6.830<sup>00</sup>

[+ WARENKORB](#)

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€6.830,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Modellnummer:  
BA-CAM-200-1200-112-EO

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):  
49.1 x 29.1 x 29.1

Eingangsstrahldurchmesser, 1/e<sup>2</sup> (mm):  
6.2

### Optische Eigenschaften

300 - 1200 **Spektralbereich:**

6200 **Maximum Focused Beam Size (µm):**

28 **Minimum Focused Spot Size (µm):**

## Sensor

2.74 x 2.74 **Pixelgröße, h x v (µm):**

4,128 x 3,008 **Pixel (h x v):**

11.31 x 8.24 **Sensorfläche, h x v (mm):**

1/1.1" **Sensorformat:**

10 **Bildrate:**

Global **Verschlusstyp:**

## Elektronische Spezifikationen

Auto or External (8-pin Hirose connector HR25-7TR-8PA(73)) - [#86-758](#) **Externer Trigger:**

1.9 – 4.0 **Leistungsaufnahme (V):**

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

GigE POE **Stecker:**

Power Supply Required and Sold Separately; Power Over Ethernet (PoE) Single Port injector - [#68-469](#) AND 2X of any of the following - [#63-863](#), [#63-864](#), [#59-231](#), [#59-232](#), [#59-233](#), [#59-234](#) **Stromversorgung:**

## Umwelt & Haltbarkeit

+0 to +50 **Betriebstemperatur (°C):**

## Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Analyse von Strahlprofil, Schwerpunkt, Elliptizität, Schwellenwert, Ebenheitsfaktor, Gleichförmigkeit des Plateaus
- Unterstützt CW- und gepulste Laserquellen
- Ideal für Lasersystemdiagnostik und Prozessoptimierung
- Konform mit den räumlichen Strahlparametern nach ISO 13694

Mit den BA-CAM Strahlanalysekameras von Haas Laser Technologies lassen sich Dauerstrichlaser (CW) und gepulste Laserquellen präzise messen und überwachen. Die BA-CAM wurde in Übereinstimmung mit den ISO 13694-Normen für Laser und lasertechnische Geräte entwickelt und bietet eine genaue räumliche Strahlcharakterisierung, um eine optimale Abbildungsleistung des Lasersystems sicherzustellen. Dieser Analysator bietet eine detaillierte Analyse des Strahlprofils, der Rundheit, der Lage des Schwerpunkts, der Elliptizität, der Schwellenwerte, des Ebenheitsfaktors und der Plateau-Gleichmäßigkeit und ermöglicht so die frühzeitige Erkennung von Ausrichtungsproblemen oder Systemverschlechterungen. Die BA-CAM Strahlanalysekameras von Haas Laser Technologies sind ohne bewegliche Komponenten konstruiert, was eine hohe Zuverlässigkeit und eine sofortige Rückmeldung über den Laserstrahl und die zugehörigen optischen Elemente gewährleistet.